


Naziv:	Skenirajući elektronski mikroskop (SEM)
Inventarni broj	
Tip opreme:	Oprema za naučnoistraživački rad i nastavu
Lokacija:	Odsjek za fiziku
Dostupnost:	Interno/Komercijalno
	
Tehničke karakteristike:	Model: JEOL JSM IT 200LA Maksimalna rezolucija: 3 nm pri naponu od 30 KV Energetska rezolucija EDS detektora: 129 eV
Godina proizvodnje:	2022
Usluge:	Snimanje površine uzoraka sa visokom rezolucijom Hemijska analiza uzoraka (EDS detekcija)
Radno vrijeme:	8-16 h
Kontakt:	Prof. dr. Maja Đekić 033 279 891 mdjekic@pmf.unsa.ba